

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 θ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ: $|\Delta(\text{LogI})|$

最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数

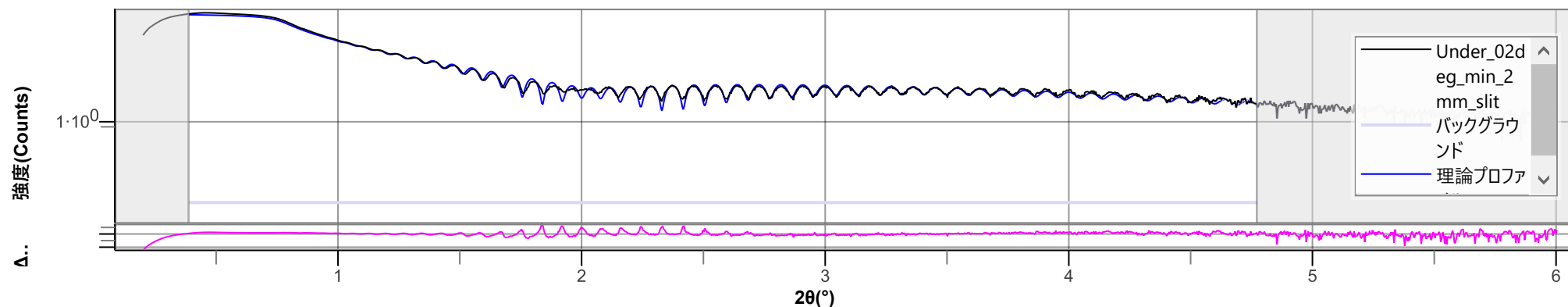
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm ³)<d>	粗さ(nm)<rg>
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe ₂ O ₃	1.015 Const	2.47500 Const	1.209 Con...
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe ₂ O ₃	2.214 Const ±0.009 精密化	4.95000 Const	0.121 Con...
	<input type="checkbox"/>	L3	Fe	0.000 Const ±0.2 最小 精密化	4.63772 Const	6.329 Con...
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	93.277 Const ±0.02 最大 精密化	7.86952 Const	0.499 Con...
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	0.940 Const ±0.09 精密化	3.93700 Const	0.466 Con...
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...